

フッ素系膜の分布状態評価および成分分析

微小領域の面分析による分布の均一性評価と有機物の同定・推定

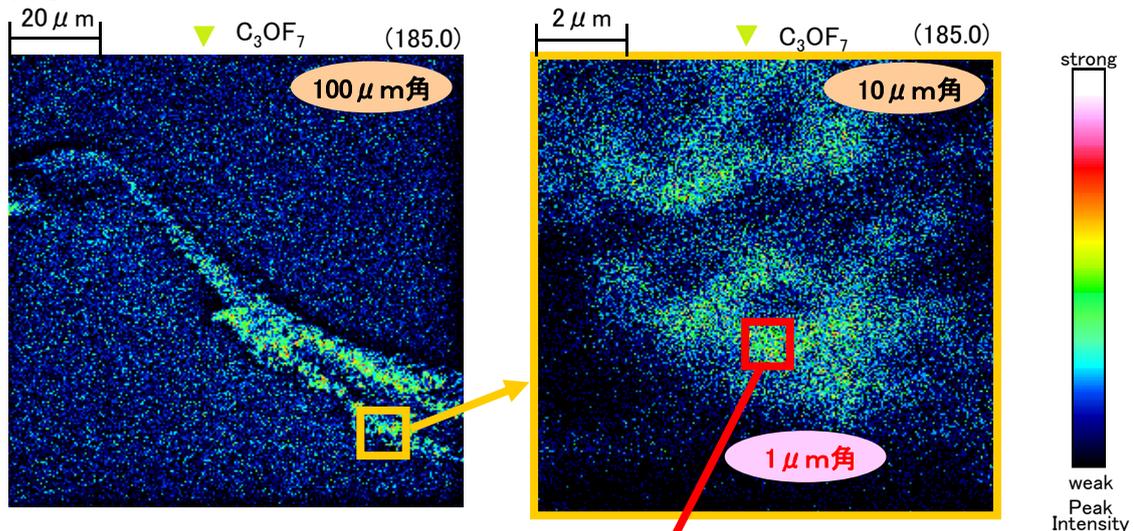
測定法 : TOF-SIMS
 製品分野 : 電子部品・日用品
 分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価

概要

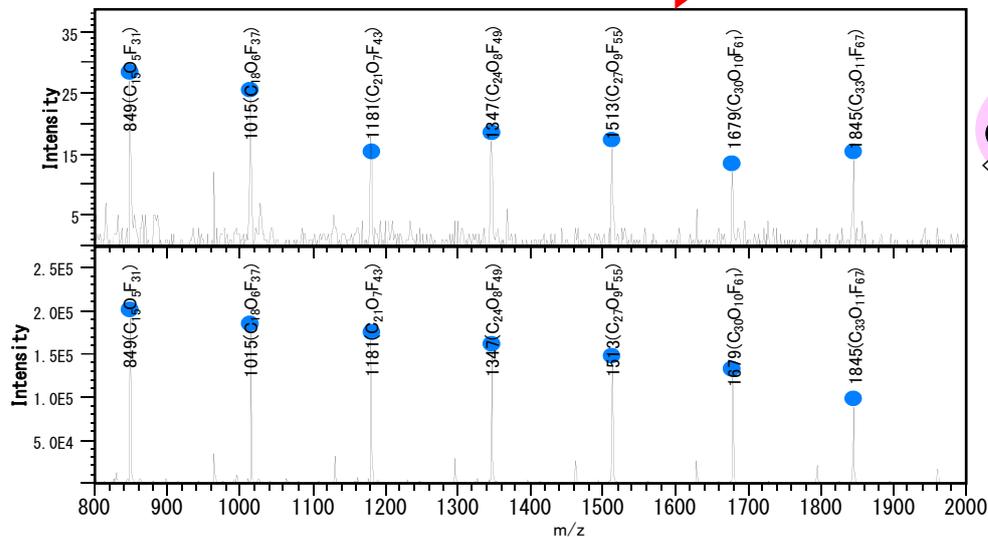
撥水処理における撥水面の状態は、フッ素系化合物が島状(アイランド状)に分布しているか均一に分布しているかの違いで異なります。そこで、TOF-SIMSを用いて、フッ素系化合物の分布の観察を行いました。その結果、不均一に分布していることがわかりました。また、1 μm角の領域で定性分析を行うことで、フッ素系膜はKrytoxであることがわかりました。

データ

■ 負イオンイメージ



■ 負イオン定性スペクトル



1 μm角
(上右図□部分)
〈サンプルデータ〉

Krytox
(標準試料)

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!